



- DIN ISO 3497, DIN 50987 ve ASTM B568 standartlarına uygundur
- Büyük parçalar, düzensiz şekilli parçalar ve küçük parçaların çok noktali testi için
- Yakınlaştırma teknolojisi ile donatılmış olup, 0'dan 70mm'ye kadar derinliğe sahip düzensiz bileşenler yüzeylerin tahribatsız test edilmesine olanak sağlar,
- Yapay zeka görüntü tanıma işlevi ve çevrimiçi algılama ile donatılmış olup, otomatik ve akıllıdır,
- Otomatik programlanabilir bir mobil platform ile donatılmış olup, otomatik büyük numune gruplarının tespiti için kullanılabilir
- Çekirdek EFP algoritması 23 kaplama katmanı, 24 elemanın eşzamanlı analizi için kullanılabilir

ÖZELLİKLER

Kaplama analizi	elementel analiz aralığı	Li(3)-U(92)
	algılama limiti	0,01µm
	kaplama kalınlığı aralığı	0,01-80µm
Analiz süresi		0~40s
Dedektör		yüksek verimli oransal dedektör
X-ray cihazı		microfocus gelişmiş ışın tüpü
Kolimatör		Ø0,2mm
En yakın ölçüm mesafesinde nokta yayılımı		<10%
Yakınlaştırma mesafesi		0~70mm
Örnek gözlem		1/2,7" yakınlaştırma işlevine sahip renkli CCD
Odaklama yöntemi		algılanamayan otomatik odaklama özelliğine sahip yüksek hassasiyetli prob
Numune aşamasının hareket modu		otomatik yüksek hassasiyetli XY platformu
XY ekseninin hareket aralığı		210×230mm
Z ekseninin hareket aralığı		145mm
Çalışma ortamı		15°C~30°C, <70%RH
Güç kaynağı		AC110/220V, 50/60Hz, 150W
Boyut (L×W×H)		535×760×635mm
Ağırlık		120kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Bilgisayar	1 set
Yazıcı	1 adet
Aksesuar çantası	1 adet
12 elemental tablet	1 set
Ni standart levha	1 adet
Ag standart levha	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kaplama çözeltisi ölçüm kabı	XRF-PT230-MC
Çözelti test membranı	XRF-PT230-SF
Au standart levha	MSS-P01
Cr standart levha	MSS-P02
Cu standart levha	MSS-P03
Zn standart levha	MSS-P04